②TEM観察

OK-Ar年代分析に用いた試料のTEM観察(使用装置: JEM-2100F)を実施し、測定物(スメクタイト)の特定を行った。

Oまた, K-Ar年代分析の測定物(スメクタイト)の結晶構造を保持しているかについても確認した。

OTEM観察の結果, 試料No.4はスメクタイトが主体, 試料No.8はスメクタイトとセピオライトが主体であり, ごくまれに斜長石が認められた。K-Ar 年代分析試料を対象に実施したXRD分析で認められた鉱物等が, TEM観察においても確認できた。

〇スメクタイトは普遍的に認められ、ほぼ自形結晶からなり、顕著な摩耗、破壊は認められない。よって、本試料を対象に実施したK-Ar年代分析により得られた年代値は、破壊を受けていないスメクタイトの形成年代を示していると判断できる。

試料No.4−1	試料No.4−2	試料No.4−3	試料No.4−4	
<u>100 nm</u> ・厚さの薄い平板状粒子の 集合体 スメクタイト	200 nm       回折像         200 nm       ·厚さの薄い平板状粒子の 集合体         スメクタイト	100 nm       回折像         100 nm       「見さの薄い平板状粒子の 集合体         スメクタイト	回折像 回折像 ・ 「するの薄い平板状粒子の 集合体 スメクタイト	
→ 新長石	500 nm       画折像は同心円状に並ばない         新長石	=式 ¥3,Nio 8−3	≣#¥∜Νο 8-4	
ā式不半INO.8 <sup>—</sup> I	ā式不针ⅣO.8 <sup>—</sup> 2	□九不升NO.8 <sup>-3</sup> □打俊	□式不半INO.8 <sup>-4</sup>	
1000 mm       ・厚さの薄い平板状粒子の 集合体         スメクタイト	<ul> <li>四が様</li> <li>四が様</li> <li>二///・</li> <li>「厚さの薄い平板状粒子の 集合体</li> <li>スメクタイト</li> </ul>	500 nm       ログロ家	200 nm       ・厚さの薄い平板状粒子の 集合体         スメクタイト	
回折像           1000           1000           1000           1000           1000           1000	回折像           ・細長い棒状の粒子	回折像           1/10           ・細長い棒状の粒子	回折像           ・細長い棒状の粒子	
500 mm セピオライト	200 nm セピオライト	500 nm セピオライト	200 nm セピオライト 5.3-2-1	

# ③EDS分析

OK-Ar年代分析に用いた試料のEDS分析(使用装置:JED-2300T ドライSD100GV検出器)を実施し,測定物(スメクタイト)の特定を行った。 Oまた,K-Ar年代分析の年代値の測定物がスメクタイトであることを確認するために,試料に含まれていたスメクタイトとセピオライトについて,カリウム(K)の 存否を確認した。

OK-Ar年代分析試料を対象に実施したXRD分析で認められた鉱物等が, EDS分析においても確認できた(詳細な分析結果は次頁以降に示す)。 OスメクタイトにはKが含まれ、セピオライトにはKが含まれていない(試料No.8-4)ことから、本試料を対象に実施したK-Ar年代分析により得られた年代値は、 スメクタイトの形成年代を示し、セピオライトの影響は及んでいないと判断できる。



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-130 再掲

## 【試料No.4-2の分析結果】 STEM像 Si 0\* Mg Al Na \*:酸化物として存在してい る固体中の酸素の量 Κ Ti Fe Ca Mn



Elem	Wt %
Na <sub>2</sub> O	0.14
MgO	5.76
$Al_2O_3$	6.95
SiO <sub>2</sub>	67.79
$P_2O_5$	0.00
K <sub>2</sub> O	0.78
CaO	1.18
TiO <sub>2</sub>	0.28
MnO	0.13
$Fe_2O_3$	16.99
Total	100.00

試料の固定にカーボン支持膜を張っ た銅製グリッドメッシュを用いているた め, Cu, Cの測定値は取り除いた。

EDS分析結果

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-131 再掲





Elem	Wt %
Na <sub>2</sub> O	0.21
MgO	6.18
$Al_2O_3$	5.29
SiO <sub>2</sub>	62.60
$P_2O_5$	0.00
K <sub>2</sub> O	2.67
CaO	2.37
TiO <sub>2</sub>	0.26
MnO	0.57
$Fe_2O_3$	19.85
Total	100.00

試料の固定にカーボン支持膜を張っ た銅製グリッドメッシュを用いているた め, Cu, Cの測定値は取り除いた。

EDS分析結果

# 【試料No.8-1の分析結果①】





\*:酸化物として存在してい

る固体中の酸素の量





Elem	Wt %			
Na <sub>2</sub> O	0.00			
MgO	6.41			
$Al_2O_3$	5.50			
SiO <sub>2</sub>	64.32			
$P_2O_5$	0.00			
K <sub>2</sub> O	1.14			
CaO	1.59			
TiO <sub>2</sub>	0.00			
MnO	0.00			
$Fe_2O_3$	21.04			
Total	100.00			

Ma K

Al

Mg

試料の固定にカーボン支持膜を張っ た銅製グリッドメッシュを用いているた め, Cu, Cの測定値は取り除いた。



Fe

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-133 再掲

## 【試料No.8-1の分析結果②】 STEM像 Si 0\* Na Mg AI \*:酸化物として存在してい る固体中の酸素の量 Ti Fe Κ Ca Mn



Wt % Elem Na<sub>2</sub>O 1.97 MgO 1.96  $Al_2O_3$ 3.10 SiO<sub>2</sub> 85.63  $P_2O_5$ 0.43 K<sub>2</sub>O 0.48 CaO 0.71 TiO<sub>2</sub> 0.21 MnO 0.62  $Fe_2O_3$ 4.89 Total 100.00

試料の固定にカーボン支持膜を張っ た銅製グリッドメッシュを用いているた め, Cu, Cの測定値は取り除いた。

# 【試料No.8-4の分析結果】 Mg K STEM像 Si 0\* Mg Al \*:酸化物として存在してい る固体中の酸素の量 Fe Κ Ca



Elem	Wt %
Na <sub>2</sub> O	0.00
MgO	9.34
$Al_2O_3$	5.63
SiO <sub>2</sub>	64.65
$P_2O_5$	0.00
K <sub>2</sub> O	1.95
CaO	1.71
TiO <sub>2</sub>	0.00
MnO	0.00
$Fe_2O_3$	16.72
Total	100.00

試料の固定にカーボン支持膜を張っ た銅製グリッドメッシュを用いているた め, Cu, Cの測定値は取り除いた。

# カリウムの長期間保持の観点による信頼性確認

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-135 再掲

○カリウムの長期間保持の観点によるK-Ar年代の信頼性確認として、下記④~⑦を実施した。
 ○下記の④により、K-Ar年代の測定物がI/S混合層であることを確認した。
 ○また、下記の⑤~⑥によると、K-Ar年代の測定物にはイライトのようにカリウムが固定される構造が含まれ、このカリウムは長期間保持されたと考えられることから、この試料のK-Ar年代値には地質学的意義がある。
 ○さらに、下記の⑦によって、測定物がI/S混合層であることを確認したことから、信頼性が確認された。

試料No.	No.4−4(岩盤調査坑 No.27孔) No.5 (E−8.5+5"孔) No.8−3 (E−8.4' 孔)	No.3(岩盤調査坑 No.24~25付近) No.4-3(岩盤調査坑 No.27孔) No.5(E-8.5+5"孔)	No.4−3(岩盤調査坑 No.27孔)	No.4−3(岩盤調査坑 No.27孔)
分析名	④XRD分析(粘土分濃集)	⑤CEC分析	⑥XAFS分析	⑦HRTEM観察
分析の 目的	<ul> <li>・第597回審査会合においては、測定物をスメクタイトと特定している         <ul> <li>一方で、試料中にはカリウムが存在するとしていた。</li> <li>⇒<u>測定物(粘土鉱物)の詳細な結晶構造を確認することによって測</u>定物がI/S混合層である可能性を検討する。</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>・K-Ar年代値が信頼性を有するには、試料中に固定されたカリウムが含まれている必要がある。</li> <li>⇒<u>粘土鉱物中の交換性カリウムと</u> 固定されたカリウムの量を分析する。</li> </ul>	<ul> <li>・K-Ar年代値が信頼性を有するには、試料中に固定されたカリウムが含まれている必要がある。</li> <li>⇒<u>粘土鉱物中に含まれるカリウム</u>原子周りの分子構造から、イライトと似た構造の存在を確認する。</li> </ul>	<ul> <li>・スメクタイトとイライトでは、単位層の間隔が異なる。</li> <li>⇒粘土鉱物の積層構造(単位層の 間隔)を観察することによって、イ ライト構造の存在を確認する。</li> </ul>
結果概要	・K-Ar年代分析の測定物(粘土鉱 物)は, I/S混合層である。	・交換性のカリウム含有量を定量し た結果,カリウム全含有量に比べ て十分に小さく,固定されたカリウ ムが十分に含まれていると判断さ れる。(宇波ほか,2019a,b)	<ul> <li>・K-Ar年代の測定物のXAFS分析の結果,カリウム原子周りの構造を表すEXAFS関数及び構造関数がイライト標準試料の関数と類似する。(宇波ほか,2019a,b)</li> </ul>	・一連の積層構造中にスメクタイト の単位層とイライトの単位層が確 認されることから、K-Ar年代分析 の測定物はI/S混合層である。 (東京大学小暮研究室ほかによる
		・K-Ar年代の測定物にはイライトのよ まれ、このカリウムは長期間保持され のK-Ar年代値には地質学的意義が	観察)	
記載頁	No.4-4⇒ <u>補足資料5.3-2</u> (2)P.5.3-2-30 No.5⇒ <u>補足資料5.3-2</u> (2)P.5.3-2-33 No.8-3⇒ <u>補足資料5.3-2</u> (2)P.5.3-2-34	No.3⇒ <u>補足資料5.3-2</u> (4)P.5.3-2-95 No.4-3⇒ <u>補足資料5.3-2</u> (4)P.5.3-2-96 No.5⇒ <u>補足資料5.3-2</u> (4)P.5.3-2-97	No.4−3⇒P.5−37(試料e)	No.4−3⇒P.5−38(試料e)

宇波謙介・福士圭介・高橋嘉夫・板谷徹丸・丹羽正和(2019a):能登半島西岸域の中新世安山岩中に認められる変質鉱物中のカリウムの存在状態とK-Ar年代の意義, 2019年度 地球化学会年会, 3P19. 宇波謙介・福士圭介・高橋嘉夫・丹羽正和(2019b):能登半島西岸域の中新世安山岩中に認められる粘土鉱物中のカリウムの存在状態, 第63回粘土科学討論会, P11.

# (10)-2 K-Ar年代分析結果及びその生成環境に関する考察(セラドナイト)

### K-Ar年代分析結果及びその生成環境に関する考察(セラドナイト)

#### セラドナイトに関する調査結果

○敷地近傍(F-1'孔)で確認された緑灰色の粘土鉱物について、敷地の変質鉱物の生成環境に関する評価との関係を確認するため、以下の分析・調査を行った。 OXRD分析の結果、緑灰色の粘土鉱物はセラドナイトであることを確認した(下図)。 〇文献調査の結果, Odin et al.(1988)は, 酸素同位体温度計から求められたセラドナイトの生成温度は6~84℃としている。

OK-Ar年代分析の結果、緑灰色の粘土鉱物(セラドナイト)のK-Ar年代値は11.8±0.4Maを示す(下表)。

#### I/S混合層に関する調査結果

粘土鉱物

○文献調査の結果, I/S混合層の生成温度は約50℃以上である(補足資料5.3-2(7) P.5.3-2-132)。 ○ K-Ar年代分析の結果、I/S混合層のK-Ar年代値は15~10Maを示す(補足資料5.3-2(10)-1 P.5.3-2-148)。

#### 上記を踏まえた考察

O上記の調査の結果、セラドナイトとI/S混合層はいずれも50℃以上で生成し、K-Ar年代値もほぼ同じ値を示すことから、敷地近傍のセラドナイトとI/S混合層はほぼ 同様な温度環境で生成したと判断した。



 $(0.2-2 \ \mu m)$ 

# (11) U-Pb年代分析結果(オパールCT)

#### 第1049回審査会合 資料1 P.118 再掲

#### OオパールCTのU-Pb年代値は、11.7±1.1Maを示す※。

※:分析位置が、1地点に限られていることから参考値とする。



# U-Pb年代分析 一測定データー

#### 〇岩盤調査坑No.30切羽のオパールCTを用いたU-Pb年代の同位体比測定データを以下に示す。



後方散乱電子像 (全35測定点)

		000 000	004 000		Total		Total		<sup>250</sup> ( <sup>234</sup> UO)
測定点	U(ppm)	<sup>232</sup> Th/ <sup>238</sup> U	<sup>204</sup> Pb/ <sup>206</sup> Pb	±%	<sup>238</sup> U/ <sup>206</sup> Pb	±%	<sup>207</sup> Pb/ <sup>206</sup> Pb	±%	/ <sup>254</sup> ( <sup>238</sup> UO)
OCT-1_1	1.7	n.d.	0.020	122	376	11	0.2618	20	0.000077
OCT-1_2	0.2	n.d.	0.036	72	162	26	0.5662	5	0.000057
OCT-1_3	1.0	n.d.	0.021	103	369	24	0.2718	30	0.000059
OCT-1_4	0.2	0.00024	0.021	148	327	17	0.3496	11	0.000074
OCT-2_1	0.3	n.d.	0.053	49	19	10	0.8027	7	0.000063
OCT-2_2	1.3	0.00012	0.029	34	271	16	0.4259	8	0.000049
OCT-2_3	0.6	0.00016	0.023	77	276	10	0.3754	6	0.000059
OCT-2_4	1.3	0.00005	0.023	28	388	18	0.3353	20	0.000051
OCT-3.1※	1.4	0.00152	0.058	27	14	27	0.9153	9	0.000066
OCT-4_1	3.6	n.d.	0.017	116	419	10	0.2666	22	0.000046
OCT-4_2	2.2	n.d.	0.006	76	468	12	0.1653	16	0.000057
OCT-4_3	1.6	n.d.	0.014	247	410	15	0.2506	33	0.000038
OCT-4_4	1.0	n.d.	0.026	124	466	19	0.3105	27	0.000055
OCT-4_5	2.0	n.d.	0.007	139	481	12	0.1408	34	0.000068
OCT-4_6	1.6	n.d.	0.008	227	374	15	0.1792	38	0.000053
OCT-4_7	1.3	n.d.	0.016	93	317	17	0.2602	33	0.000039
OCT-4_8	1.0	n.d.	0.002	68	483	22	0.1291	23	0.000078
OCT-4_9	0.6	0.00005	0.016	117	332	22	0.2183	25	0.000062
OCT-4_10	0.8	n.d.	0.011	85	333	9	0.2182	35	0.000054
OCT-4_11	0.6	n.d.	0.013	3	438	13	0.2452	28	0.000045
OCT-4.12※	1.2	0.00123	0.031	45	13	54	0.8322	42	0.000084
OCT-4_13	1.2	0.00002	0.024	64	231	11	0.4130	13	0.000067
OCT-4_14	0.7	n.d.	0.014	84	325	12	0.2833	33	0.000068
OCT-4_15	0.7	n.d.	0.012	41	477	26	0.2707	22	0.000054
OCT-4_16	0.3	n.d.	0.018	39	229	19	0.3192	21	0.000038
OCT-4_17	0.4	n.d.	0.025	72	298	18	0.3915	33	0.000075
OCT-4_18	0.6	n.d.	0.026	38	243	28	0.4455	29	0.000044
OCT-4_19	0.4	n.d.	0.032	49	279	14	0.4913	19	0.000076
OCT-4_20	0.5	n.d.	0.025	73	404	30	0.3143	31	0.000043
OCT-4_21	0.4	n.d.	0.022	98	383	33	0.3624	26	0.000040
OCT-5_1	3.5	0.00004	0.015	83	415	21	0.2605	28	0.000065
OCT-5_2	7.1	0.00016	0.013	80	574	13	0.1879	13	0.000038
OCT-5_3	2.5	0.00033	0.017	21	506	13	0.2786	11	0.000054
OCT-5_4	1.1	0.00018	0.008	2	442	29	0.1800	19	0.000054
OCT-5_5	1.3	n.d.	0.018	77	445	18	0.2428	23	0.000070

#### 測定データ

n.d.:検出不可。 誤差は1 σ

※全35測定点のうち、OCT-3\_1は、測定点に一次イオンが不安定になったこと、OCT-4\_12は、inclusionを含む分析データの可能性があることから、年代計算の根拠データから除外した。

# (12) 敷地周辺の変質に関する調査結果

# 敷地周辺で確認される変質鉱物 一別所岳安山岩類における変質状況一

〇敷地周辺の赤住,福浦灯台,巌門,生神東部及び福浦断層で認められる粘土鉱物を対象として,粘土鉱物のXRD分析による結晶構造判定を 行った結果,これらの敷地周辺で確認される粘土鉱物は,敷地と同程度のイライト混合率をもつI/S混合層であると判定した(次頁)。
〇よって,敷地で確認される変質鉱物(I/S混合層)が,敷地内に限って分布するものではなく,敷地周辺の別所岳安山岩類中にも広く分布することから,敷地周辺一帯は同じような環境下で変質を被ったと判断した。

紫字:第1073回審査会合以降に追加・変更した箇所



# 【粘土鉱物の結晶構造判定】

〇赤住, 福浦灯台, 巌門, 生神東部及び福浦断層で確認された粘土鉱物<sup>※</sup>のX線回折チャートを用いて粘土鉱物の構造判定を行った。これらの回折チャートでは, Watanabe(1988)によるI/S混合層の理論的なピーク回折角のシフトと同様なシフトが認められ, 渡辺(1986, 1981)のI/S混合層構造判定図によるとイライト混合率 5~15%程度となることから, これらの粘土鉱物は, 敷地と同程度のイライト混合率をもつI/S混合層であると判定した。



## 【赤住】

〇敷地の南方約1kmに位置する赤住の海岸部では、露岩した別所岳安山岩類中に脈状の白色の変質部が確認される。



X線回折チャート(定方位)

### 【福浦灯台】

〇敷地から約2km北方に位置する福浦灯台の海岸部では、露岩した別所岳安山岩類中に白色の変質部が確認される。



X線回折チャート(定方位)

【巌門】

〇敷地から約4km北方に位置する巌門の海岸部では、露岩した別所岳安山岩類中に脈状の白色の変質部が確認される。



X線回折チャート(定方位)

 $2\theta$  (deg)

### 【生神東部】

〇敷地の北方約7kmに位置する生神東部の別所岳安山岩類露岩部では、変質が認められる。



X線回折チャート(定方位)

## 【福浦断層(FK-1孔)】

O敷地の北方約2kmで実施したFK-1孔の深度52.5m付近で認められる福浦断層では、断層ガウジ中に粘土鉱物が認められる。



X線回折チャート(定方位)

## 【福浦断層(OS-2孔)】

#### 〇敷地の東方約1kmで実施したOS-2孔の深度94.6m付近で認められる福浦断層では、断層ガウジ中に粘土鉱物が認められる。











X線回折チャート(定方位)

## 【福浦断層(OS-3'孔)】

#### 〇敷地の東方約1kmで実施したOS-3'孔の深度28.3m付近で認められる福浦断層では、断層ガウジ中に粘土鉱物が認められる。







分析試料





## 敷地周辺で確認される変質鉱物 -新第三紀堆積岩における変質状況-

○敷地周辺一帯が同じような環境下で変質を被ったと判断したことについて,敷地周辺の別所岳安山岩類に加え,その周辺の新第三紀堆積岩の変質状況を調査した。
 ○敷地周辺の新第三紀堆積岩(黒瀬谷階の縄又互層,谷出礫岩層,山戸田泥岩層)中の粘土鉱物を対象として,XRD分析による結晶構造判定を行った結果,これらの敷地周辺で確認される粘土鉱物は,敷地と同程度のイライト混合率をもつⅠ/S混合層であると判定した(次頁)。

紫字:第1073回審査会合以降に追加・変更した箇所



#### <粘土鉱物の結晶構造判定結果>



### 粘土鉱物の結晶構造判定

○鬼屋,田尻滝及び横田で確認された粘土鉱物<sup>※</sup>のX線回折チャートを用いて粘土鉱物の構造判定を行った。これらの回折チャートでは、Watanabe(1988)によるI/S 混合層の理論的なピーク回折角のシフトと同様なシフトが認められ、渡辺(1986, 1981)のI/S混合層構造判定図によるとイライト混合率10~15%程度となることか ら、これらの粘土鉱物は、敷地と同程度のイライト混合率をもつI/S混合層であると判定した。



#### 第1049回審査会合 資料1 P.103 再掲

### 鬼屋(縄又互層)

〇敷地の北方約25kmに位置する鬼屋の縄又互層露岩部で試料(砂岩)を採取し、XRD分析を実施した。



### 田尻滝(谷出礫岩層)

〇敷地の北東方約15kmに位置する田尻滝の谷出礫岩層露岩部で試料(砂岩)を採取し、XRD分析を実施した。



### 横田(山戸田泥岩層)

〇敷地の北東方約13kmに位置する横田の山戸田泥岩層露岩部で試料(泥岩)を採取し、XRD分析を実施した。



## 敷地周辺で確認される変質鉱物 一局所的な変質状況一

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-137 一部修正

〇敷地周辺の別所岳安山岩類中の局所的な変質状況に関する調査結果を以下に示す。

・敷地周辺の鉱山(富来鉱山や沢口鉱山)では,石英等が認められている(次頁)。

・敷地東方の強変質部(大坪川ダム右岸付近)では、網目状の熱水脈が認められ、石英等の変質鉱物を確認した(次々頁)。

Oなお、これらの変質帯は、地表踏査により分布が局所的であることを確認している。

< 敷地周辺の別所岳安山岩類中で確認される局所的な変質>

![](_page_28_Figure_7.jpeg)

### 【富来鉱山, 沢口鉱山】

○敷地周辺の鉱山に関する文献調査の結果,敷地の約7km北方には富来鉱山が,敷地の約4km東方には沢口鉱山が分布する。 〇富来鉱山は、別所岳安山岩類中に浅熱水性含金石英脈を伴う鉱床であり、石英等が確認されている。 〇沢口鉱山は、別所岳安山岩類の境界に富鉱部を持つ銅鉱山とされる。また、XRD分析の結果、鉱山周辺で石英等を確認した。

![](_page_29_Figure_3.jpeg)

|--|

-KNs

日本金山誌編纂委 員会編(1994)	<ul> <li>&lt;富来(広地)鉱山&gt;</li> <li>・富来鉱山(広地)付近の地質は新第三紀中新世の穴水累層に属する輝石安山岩溶岩および火山砕屑岩よりなり、鉱床は輝石安山岩を母岩とする浅熱水性含金銀石英脈である。</li> <li>&lt;<u>&lt;富来(生神)鉱山&gt;</u></li> <li>・鉱床は輝石安山岩および火山砕屑岩を母岩とする浅熱水性含金石英脈で、ほぼ2kmX2kmの範囲に複数の脈がある。鉱石鉱物は自然金のほか黄鉄鉱を主とし、脈石鉱物は石英を主とし乳白色を呈する。</li> </ul>
濱田ほか(2018)	<富来(生神)鉱山> <ul> <li>・母岩である穴水累層の輝石安山岩は熱水変質を受けており、ほとんどが暗青灰色から明青緑色である。斑晶である輝石および斜長石は緑泥石、雲母類、白チタン石などに変質しているか、交代されている。母岩中に石英の細脈が見られその周辺に黄鉄鉱や黄銅鉱が産出する。これらの硫化鉱物および変質鉱物は鉱床形成に伴う熱水作用によって生じたと考えられる。</li> </ul>
Hamada et al. (2019)	<富来(生神)鉱山> <ul> <li>・富来鉱山は, 能登半島と日本海の形成に関連した重要な鉱床の一つである。</li> <li>・石英脈の表面に生成した氷長石の状況から, 複数回の熱水イベントが示唆される。</li> <li>・鉱床中に認められたイライト-スメクタイト混合層の年代によると富来鉱山の形成年代は前期中新世である。</li> </ul>

#### ■沢口鉱山に関する知見

#### ■沢口鉱山周辺で確認される変質鉱物(XRD分析)

![](_page_29_Picture_9.jpeg)

![](_page_29_Figure_10.jpeg)

![](_page_29_Figure_11.jpeg)

![](_page_29_Figure_12.jpeg)

沢口鉱山 坑口跡

採取した白色鉱物

### 【大坪川ダム右岸】

○敷地の約1km東方に位置する大坪川ダム周辺では、岩盤(別所岳安山岩類)が全体的に熱水等による影響を受けており、白色硬質部や網目状節理に沿う白色脈が多く認められる。

○ダム右岸の北道路法面や南道路法面の表土はぎで確認される白色変質部を対象としたXRD分析の結果,主な変質鉱物として石英やオパールCT(クリストバライト とトリディマイト),カオリナイト,ソーダ明礬石を確認した。

![](_page_30_Figure_4.jpeg)

沢口鉱山 白色鉱物 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-140 再掲

![](_page_31_Figure_2.jpeg)

<sup>5.3-2-185</sup> 

大坪川ダム北道路法面 白色変質部 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-141 再掲

![](_page_32_Figure_2.jpeg)

回折チャート

大坪川ダム北道路法面 白色変質部 ーX線回折チャート 定方位 EG処理ー 第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-142 再掲

![](_page_33_Figure_1.jpeg)

大坪川ダム南道路法面 白色変質部 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-143 再掲

![](_page_34_Figure_2.jpeg)

回折チャート

![](_page_35_Figure_1.jpeg)
# (13) 敷地深部の変質に関する調査結果

敷地深部で認められる変質鉱物

○大深度ボーリング(K-13.6孔)の変質部を対象にXRD分析を実施した結果,主な鉱物として石英及び硬石膏が確認された(次頁,次々頁)。 O大深度ボーリングを含むボーリングで確認されたオパールCT及び石英について、深度ごとに回折チャートを整理した結果、標高約-200m以浅ではオパールCTが 確認され、標高約-100m以深では石英が認められた(右下図)。



#### <オパールCTから石英への深度変化> クリストバライトとトリディマイト 試料位置 のピーク(オパールCT) (K-13.6孔以外の位置図は 補足資料5.3-2(1)P.5.3-2-22) 0 試料i 試料 v 試料iii 試料viii -100 試料iv 試料ix -200 K-13.6孔\_深度236.4m 石英のピーク 標高(m) -300 -400 K-13.6孔\_深度457.7m -500 K-13.6孔\_深度542.3m -600 -700 K-13.6孔\_深度734.0m -800 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

 $2\theta$  (deg)



# <u>K−13.6孔 深度236.4m付近</u>



分析試料

minin







第1049回審査会合 机上配布資料1

P.5.2-2-146 再揭

大深度ボーリング(K-13.6孔) 試料採取位置 一白色鉱物-

🔵 試料採取位置



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-147 再揭

試料採取位置

#### K-13.6孔 深度734.0m付近



## <u>K-13.6孔 深度981.1m付近</u>







分析試料



# 大深度ボーリング(K-13.6孔) - XRD分析結果-

#### 第1049回審査会合 資料1 P.81 一部修正

#### 紫字:第1073回審査会合以降の変更箇所

			検出鉱物							
		石英	クリストバライト	トリドィマイト	スメクタイト	斜長石	クリノタイロライト	方解石	硬石膏	
	K−13.6孔_236.4m付近_白色鉱物	0	Δ	+	+	+1				
	K−13.6孔_457.7m付近_白色鉱物	0	+		Ŧ	+	±			
	K−13.6孔_542.3m付近_白色鉱物	Ø	Ŧ		±			H		
	K−13.6孔_734.0m付近_白色鉱物	0	+I		+1				+	◎:多量(>5,000cps) 〇:中量(2,500~5,00
※試料採取位置( <b>補足資料5.3-2</b> (9)P.5.3-2-145)のの深度に修正	K-13.6孔_981.1 <sup>※</sup> m付近_白色鉱物	H							Ø	△:少量(500~2,500c +:微量(250~500cp ±:きわめて微量(<)
	K−13.6孔_989.2m付近_白色鉱物	0				±			Ø	標準ロ央 東 強 回 折 約 (3回繰り返し 測定,平

XRD分析結果

)0cps) )cps) ps) 250cps) 線強度 <sup>2</sup>均53,376cps)



その他の白色鉱物のX線回折チャートは、次頁以降

K-13.6孔\_深度236.4m 白色鉱物 −X線回折チャート 不定方位--

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-148 再掲



回折チャート

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-149 再掲



K-13.6孔\_深度457.7m 白色鉱物 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-150 再掲



<sup>5.3-2-197</sup> 

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-151 再掲



K-13.6孔\_深度542.3m 白色鉱物 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-152 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-153 再掲



K-13.6孔\_深度734.0m 白色鉱物 -X線回折チャート 不定方位--□<sup>™</sup>

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-154 再掲



## K-13.6孔\_深度734.0m 白色鉱物 ーX線回折チャート 定方位 EG処理ー

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-155 再掲



回折チャート (EG処理も合わせて表示) K-13.6孔\_深度981.1m 白色鉱物 −X線回折チャート 不定方位--

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-156 再掲



回折チャート

K-13.6孔\_深度989.2m 白色鉱物 −X線回折チャート 不定方位 – <sup>[\*\*</sup>

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-157 再掲



## (14) 変質鉱物と第四系との関係に関する調査結果

# (14)-1割れ目に認められる白色脈と第四系との関係

## 割れ目に認められる白色脈と第四系との関係



•No.2トレンチ、35m盤法面及び大坪川ダム右岸トレンチでは、別所岳安山岩類中の割れ目に沿っ て白色脈が認められる。この白色脈は、別所岳安山岩類の上面で削剥され、上位の第四系(MI 段丘堆積物, HI a段丘堆積物等)に覆われており, 第四系には認められないことを確認した(補 足資料5.3-2(14)-1 P.5.3-2-208~215)。

・このことから、この白色脈の形成時期は第四系の堆積時期よりも古いと判断した。

・この白色脈について、XRD分析を実施した結果、風化変質鉱物であるハロイサイトが認められた ものの、I/S混合層は認められない。

**震** 面 囲 本 灶 甲

	路與砌里	四木	
地点	別所岳安山岩類	第四系	参照頁
No.2トレンチ	・別所岳安山岩類中の割れ目	・MI段丘堆積物中に変質鉱	<u>補足資料5.3−2</u> (14)−1
	に沿って白色脈が認められる。	物脈は認められない。	P.5.3−2−208~211
35m盤法面	・別所岳安山岩類中の割れ目	・HIa段丘堆積物中に変質鉱	<u>補足資料5.3−2</u> (14)−1
	に沿って白色脈が認められる。	物脈は認められない。	P.5.3−2−212, 213
大坪川ダム右岸トレンチ	・別所岳安山岩類中の割れ目	・砂層(層理部)中に変質鉱物	<u>補足資料5.3−2</u> (14)−1
	に沿って白色脈が認められる。	脈は認められない。	P.5.3−2−214, 215

#### XRD分析結果

	検出鉱物							
試料採取位置	標高	石英 ※	クリストバライト	7	10 ペ型ハロイサイト	緑泥石	赤鉄鉱	
No.2トレンチ東面 白色脈	EL 19m	±	±	Δ	±	±		
No.2トレンチ南面 白色脈	EL 19m	+	+	Δ	±	±		
35m盤法面 白色脈	EL 36m	±	+	Δ	±	±	±	

Divergence Slit:1°

Scattering Slit:1°

Scanning Sped:2° /min

Scanning Mode:連続法

Sampling Range:0.02°

Scanning Range:2~61

#### XRD分析結果

試料採取位置	標高	石英 ※	クリストバライト	7   ペ型ハロイサイト	10 ゚型ハロイサイト	ギブサイト	カオリナイト	バーミキュライト
大坪川ダム右岸トレンチ 白色脈	EL 51m	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

#### 量比 △:少量だが検出される(<5,000cps)

XRD分析 測定諸元
装置:Rigaku RINT2500V
Target:Cu(K $\alpha$ )
Voltage:40kV
Detector:SC
Divergence Slit:0.5°
Receiving Slit:0.15mm
Step size:0.02°

#### ※白色脈中の石英は、堆積物中に含まれる石英 (補足資料5.3-1(1)P.5.2-1-51,58)が流入してき たものと考えられる。

試料採取位置,分析試料写真, XRD回折チャートは補足資料5.3-2(14)-2

### 【割れ目に認められる白色脈と第四系の関係(No.2トレンチ 東面 1/2)】



No.2トレンチ東面 全体スケッチ※ ※このスケッチは,拡大範囲①スケッチと作成時期が異なるため,礫の分布や岩盤上面・割れ目等の形状が一部異なる。



拡大範囲① 写真





拡大範囲① 写真(岩盤上面等を加筆)

#### 【割れ目に認められる白色脈と第四系の関係(No.2トレンチ 東面 2/2)】



拡大範囲② 写真



拡大範囲② 写真(岩盤上面等を加筆)



拡大範囲③ 写真



拡大範囲③ 写真(岩盤上面等を加筆)

## 【割れ目に認められる白色脈と第四系の関係(No.2トレンチ 南面 1/2)】



No.2トレンチ南面 全体スケッチ※ ※このスケッチは、拡大範囲①スケッチと作成時期が異なるため、礫の分布や岩盤上面・割れ目等の形状が一部異なる。



拡大範囲① 写真







拡大範囲② 写真



拡大範囲② 写真(岩盤上面等を加筆)

第1049回審査会合 資料1 P.112 再掲

#### 【割れ目に認められる白色脈と第四系の関係(35m盤法面 1/2)】



※このスケッチは、拡大範囲①スケッチと作成時期が異なるため、礫の分布や岩盤上面・割れ目等の形状が一部異なる。



拡大範囲① 写真





【割れ目に認められる白色脈と第四系の関係(35m盤法面 2/2)】

拡大範囲② 写真



拡大範囲② 写真(岩盤上面等を加筆)

### 【割れ目に認められる白色脈と第四系の関係(大坪川ダム右岸トレンチ 1/2)】





・変質した安山岩(角礫質)中に、局所的に安山岩(均質)が分布する。この安山岩(均質)の割れ目に挟在して、褐白〜褐色を呈する幅1〜2cm程度の白色脈が分布する。
 ・白色脈には、高角〜鉛直方向に分布するものが多く、副次的に水平方向のものも伴う。また、幅6〜8cmの水平方向の脈が例外的に一条分布する。
 ・高角〜鉛直方向に分布する白色脈の上端は、岩盤と砂層(層理部)の境界で凹状に削剥されており、砂層(層理部)中へは延長しない(次頁拡大範囲②)。

#### 【割れ目に認められる白色脈と第四系の関係(大坪川ダム右岸トレンチ 2/2)】



拡大範囲① 写真



拡大範囲② 写真





拡大範囲② 写真(岩盤上面等を加筆)

#### 5.3-2-215

拡大範囲① 写真(岩盤上面等を加筆)

# (14)-2 X線回折分析結果

## 試料採取位置

#### () 試料採取位置

<u>駐車場南側法面 粘土状破砕部</u>





分析試料 (駐車場南側法面\_上)



分析試料 (駐車場南側法面\_下) <u>No.2トレンチ東面 白色脈</u>



#### <u>No.2トレンチ南面 白色脈</u>



分析試料 (No.2トレンチ東面)



28 29 **26** 31 32 33 34 25 36 3 分析試料 (No.2トレンチ南面)



28 29 **20** 31 32 33 34 35 36 分析試料 (35m盤法面)

#### <u>大坪川ダム右岸トレンチ 白色脈</u>





分析試料 (大坪川ダム右岸トレンチ)

5.3-2-217

## <u>N-14孔 深度30.97m付近 粘土状破砕部</u>



<u>M-12.5"孔 深度50.00m付近 粘土状破砕部</u>



固結した破砕部 粘土状破砕部 固結した破砕部



分析試料 (N−14孔)





35m盤法面 白色脈

白色脈 (XRD試料採取箇所

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-159 再掲\_



## 駐車場南側法面\_上 粘土状破砕部 -X線回折チャート 定方位 EG処理-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-160 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-161 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-162 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-163 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-164 再掲



M-12.5"孔 粘土状破砕部 ーX線回折チャート 不定方位-



回折チャート

M-12.5"孔 粘土状破砕部 ーX線回折チャート 定方位 EG処理- 第1049回審査会 机上配布資料1 P.5.2-2-166 再掲



回折チャート (EG処理も合わせて表示)












大坪川ダム右岸トレンチ 白色脈 ーX線回折チャート 不定方位- 第1049回審査会 机上配布資料1 P.5.2-2-173 再掲

> Qtz:石英 Crs:クリストバライト Kln:カオリナイト Gbs:ギブサイト Ha7:7Å型ハロイサイト Ha10:10型ハロイサイト



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-2-174 再掲



# (15) 破砕部中の鉱物脈

5.3-2-235



拡大写真(M-12.5孔 63.5~63.7m)

 ボーリングコア観察の結果,破砕部中に鉱物脈を確認した。鉱物脈は固結した破砕部中に 認められ,それらに変位・変形は認められない。

#### 【L-12.2孔 X線回折チャート 不定方位】

〇鉱物脈でXRD分析を実施した結果,主な粘土鉱物としてスメクタイトが認められる。



### 【L-12.2孔 X線回折チャート 定方位 EG処理】



第1049回審査会合 資料1 P.129 一部修正



拡大写真(N-14孔 31.0~31.2m)

#### 【N-13'孔 X線回折チャート 不定方位】

〇鉱物脈でXRD分析を実施した結果,主な粘土鉱物としてスメクタイトが認められる。



#### 【N-13'孔 X線回折チャート 定方位 EG処理】



# 【破砕部中に認められた鉱物脈(S-2-S-6)】







S-2•S-6写真(H-6.5'孔)



拡大写真(E-8.6孔 12.0~12.2m)



拡大写真(H-6.5'孔 34.4~34.6m)



第1049回審査会合 資料1 P.134 再掲

#### 【E-8.6孔 X線回折チャート 定方位 EG処理】









拡大写真(H-6.4孔 94.5~94.7m)



\*\*\*\*\*

右拡大範囲

3-1

3-2 1

S-7写真(H-5.7孔)

(3)-2

<u>3</u>–1



拡大写真(H-5.7孔 13.1~13.3m)





拡大写真(H-6.5孔 46.2~46.4m)





第1049回審査会合 資料1 P.140 再揭



第1049回審査会合 資料1 P.141 再掲





## 【H-1.1孔(白色の鉱物脈) X線回折チャート 定方位 EG処理】



(EG処理も合わせて表示)

【H-1.1孔(オリーブ色の鉱物脈) X線回折チャート 定方位(粘土分濃集)】

Oオリーブ色の鉱物脈でXRD分析(粘土分濃集)による結晶構造判定を実施した結果,粘土鉱物(スメクタイト)はI/S混合層であると判定した。







拡大写真(G-1.5-35孔 40.1~40.3m)



本コアには一部,グラウト影響(白色~灰色)が認められる。

第1049回審査会合 資料1



イライト混合割合




拡大写真(H--3.0-55孔 78.1~78.3m)

## (16) 破砕部と変質鉱物の形成プロセス

第1049回審査会合 資料1 P.487 一部修正

## 破砕部と変質鉱物の形成プロセス 一概要一

〇敷地における破砕部及び変質鉱物の形成プロセスについて,薄片観察等の観察事実を踏まえて整理した模式図を以下に示す。

〇現在の固結した破砕部に対応する破砕部は,安山岩形成時に正断層センスの断層活動によって形成され,現在の粘土状破砕部に対応する破砕部は, その後の逆断層センスの断層活動によって形成された。

〇変質鉱物は、少なくとも12~13万年前以前に生成した。なお、薄片観察により、I/S混合層とその他の変質鉱物の新旧関係として、I/S混合層生成後のオパールCT生成、フィリプサイト生成、砕屑岩脈形成を確認した。

〇変質鉱物を確認した位置について、次頁に位置図と表で示す。

Oまた, 断層活動と鉱物脈法による活動性評価に用いた変質鉱物等(I/S混合層, 砕屑岩脈)との関係について, 補足資料5.3-2(16) P. 5.3-2-264, 265に模式図で示す。



第1049回審査会合 資料1 P.488 一部修正

### 【変質鉱物の確認位置】

#### 紫字:第1073回審査会合以降の追加・変更箇所

鉱物脈法による評価を実施した位置及び変質鉱物の確認位置



## 破砕部と変質鉱物の形成プロセス 一断層活動とI/S混合層の関係一

### 〇断層活動(最新面)とI/S混合層に関する形成プロセスの模式図を以下に示す。 〇最新活動後に, I/S混合層が生成し,最新面が不連続になった。







・断層活動により最新ゾーン及び最新面が形成された。

 最新活動後に変質を被り、割れ目や岩片等の縁辺部、破砕部に I/S混合層が生成し、最新面が不連続になった。

## 破砕部と変質鉱物の形成プロセス 一断層活動と砕屑岩脈の関係一

〇断層活動(最新面)と砕屑岩脈に関する形成プロセスの模式図を以下に示す。 〇最新活動後に, I/S混合層が生成し, さらにその後最新面及び最新ゾーン全体を横断して砕屑岩脈が形成した。





・断層活動により最新ゾーン及び最新面が形成された。

・最新活動後に変質を被り、割れ目や岩片等の縁辺部、破砕部 にI/S混合層が生成した。 ・I/S混合層生成後に最新面及び最新ゾーン 全体を横断して砕屑岩脈が形成した。

5.3-2-267



# 補足資料5.3-3

# 鉱物脈法に関する調査結果(鉱物組成,運動方向等)

# (1) X線回折分析結果

#### 第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-3 一部修正





試料採取位置

#### 試料採取位置図

断層	試料採取位置		
	採取位置(左位置図)	深度	標高
S-1	a H-6.5-2孔	70.70m	EL -49.50m
	b H-6.6-1孔	57.25m	EL -37.95m
	c H-6.7孔	35.10m	EL -19.01m
	d K-10.3SW孔	27.81m	EL -6.17m
	e M-12.5"孔	49.96m	EL -21.66m
S-2•S-6	f K-6.2-2孔	30.94m	EL -19.45m
	g F-8.5' 孔	8.50m	EL 12.63m
	h E-8.5-2孔	8.55m	EL 12.66m
S-4	i E-8.50'"孔	111.95m	EL -39.83m
	j E-8.60孔	104.68m	EL -35.91m
	k E-11.1SE-2孔	1.65m	EL 19.72m
S-5	v R-8.1-1-2孔	23.46m	EL -12.38m
	I R-8.1-1-3孔	22.24m	EL -11.12m
S-7	m H-5.4-1E孔	24.16m	EL 4.80m
	n H-5.7' 孔	14.35m	EL -3.26m
S-8	o F-6.75孔	26.85m	EL -15.76m
K-2	p H-1.1-87孔	84.30m	EL-77.40m
	q H-1.1孔	103.62m	EL -96.84m
	w G-1.5-80孔	77.82m	EL -72.12m
K-3	r M-2.2孔	48.74m	EL -31.45m
K-14	s H0.3-80孔	31.65m	EL -27.48m
	t H'1.3孔	125.58m	EL -121.91m
K-18	x H-0.2-60孔	84.35m	EL -68.32m
	u H-0.2-75孔	116.75m	EL -108.04m

#### XRD分析 測定諸元

装置:理学電気製 MultiFlex Target:Cu(K α) Monochrometer:Graphite 湾曲 Voltage:40kV Current:40mA Detector:SC Calculation Mode:cps

Scattering Slit:1° Receiving Slit:0.3mm Scanning Sped:2°/min Scanning Mode:連続法 Sampling Range:0.02° Scanning Range:2~61°

Divergence Slit:1°

5.3-3-3

粘土状破砕部 S-1 H-6.5-2孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-4 再掲



回折チャート

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-5 再掲



粘土状破砕部 S-1 H-6.6-1孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-6 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-7 再掲



粘土状破砕部 S-1 H-6.7孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-8 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-9 再掲



粘土状破砕部 S-1 K-10.3SW孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-10 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-11 再掲



5.3-3-11

粘土状破砕部 S-1 M-12.5"孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-12 再掲



回折チャート

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-13 再掲



回折ナヤート (EG処理も合わせて表示)

粘土状破砕部 S-2・S-6 K-6.2-2孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-14 再掲



回折チャート

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-15 再掲



粘土状破砕部 S-2•S-6 F-8.5'孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-16 再掲



粘土状破砕部 S-2・S-6 F-8.5'孔 -X線回折チャート 定方位 EG処理-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-17 再掲



粘土状破砕部 S-2・S-6 E-8.5-2孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-18 再掲



回折チャート

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-19 再掲



粘土状破砕部 S-4 E-8.50" 孔 ーX線回折チャート 不定方位ー

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-20 再掲



回折チャート

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-21 再掲



粘土状破砕部 S-4 E-8.60孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-22 再掲



回折チャート

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-23 再掲



粘土状破砕部 S-4 E-11.1SE-2孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-24 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-25 再掲



回折テャート (EG処理も合わせて表示)

粘土状破砕部 S-5 R-8.1-1-2孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-26 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-27 再掲



粘土状破砕部 S-5 R-8.1-1-3孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-28 再掲



回折チャート

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-29 再掲


粘土状破砕部 S-7 H-5.4-1E孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-30 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-31 再掲



粘土状破砕部 S-7 H-5.7'孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-32 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-33 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-34 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-35 再掲



粘土状破砕部 K-2 H-1.1-87孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-36 再掲



回折チャート

粘土状破砕部 K-2 H-1.1-87孔 -X線回折チャート 定方位 EG処理-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-37 再掲



粘土状破砕部 K-2 H-1.1孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-38 再掲



粘土状破砕部 K-2 H-1.1孔 -X線回折チャート 定方位 EG処理-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-39 再掲



粘土状破砕部(白色部) K-2 H-1.1孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-40 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-41 再掲



第1073回審査会合 資料2 P.75 再掲





固結した破砕部 K-3 M-2.2孔 −X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-42 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-43 再掲



粘土状破砕部 K-14 H--0.3-80孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-44 再掲



粘土状破砕部 K-14 H--0.3-80孔 -X線回折チャート 定方位 EG処理-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-45 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-46 再掲



第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-47 再掲



第1073回審査会合 資料2 P.133 再掲

### 粘土状破砕部 K-18 H-0.2-60孔 -X線回折チャート 不定方位-



第1073回審査会合 資料2 P.134 再掲

粘土状破砕部 K-18 H-0.2-60孔 -X線回折チャート 定方位 EG処理-



粘土状破砕部 K-18 H-0.2-75孔 -X線回折チャート 不定方位-

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-48 再掲



回折チャート

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-49 再掲



## (2) 条線観察結果

## (2)-1 S-1の条線観察結果

# <u>S-1の条線観察結果</u>

#### 第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-52 再掲

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線の レイク <sup>※1</sup>	変位センス (条線観察)
ボーリングH-6.5-2孔 [深度70.70m]	上盤側	N58° W⁄74° NE	66°R	(不明)
ボーリングH-6.6-1孔 [深度57.20m]	下盤側	N66° W⁄80° NE	71°R	(不明)
ボーリングM-12.5"孔 [深度50.00m]	上盤側	N51° W/79° NE	65°R	(不明)

※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。



## 条線観察結果 ボーリングH-6.5-2孔[深度70.70m](上盤側)

第1049回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-53 再掲







観察面写真

観察面拡大写真

詳細観察写真

**잝線方向** 

114°

・条線のレイクは66°R(下盤側換算),変位センスは不明